#### Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

Факультет физико-технический



## Б2.В.02.03(Пд) РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки/специальность 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль) / специализация «Нанотехнологии в электронике»

Программа подготовки академическая

Форма обучения очная

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Рабочая программа производственной практики (Б2.В.02.03(Пд) преддипломной практики) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (профиль «Нанотехнологии в электронике»)

Программу составил:

Г.Ф. Копытов, профессор кафедры радиофизики и нанотехнологий ФТФ КубГУ, доктор физ.-мат. наук

1

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры радиофизики и нанотехнологий протокол № 12 «\_21\_»\_мая\_2015 г. Заведующий кафедрой (разработчика) Копытов Г.Ф. фамилия, инициалы

4

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры радиофизики и нанотехнологий протокол № 12 «\_21\_»\_мая\_2015 г. Заведующий кафедрой (выпускающей) Копытов Г.Ф. фамилия, инициалы

1

Утверждена на заседании учебно-методической комиссии физико-технического факультета протокол № 10 «\_29\_»\_мая\_2015 г. Председатель УМК факультета Богатов Н.М.

toward

#### Рецензенты:

Гаврилов А.И., доцент кафедры физики КубГТУ, канд. физ.-мат. наук

Исаев В.А., заведующий кафедрой теоретической физики и компьютерных технологий КубГУ, д-р физ.-мат. наук

фамилия, инициалы

#### 1. Цели производственной (преддипломной) практики.

**Целью производственной** (преддипломной) практики является получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Выполнение программы производственной (преддипломной) практики обеспечивает проверку теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время прохождения производственной практики.

#### 2. Задачи производственной (преддипломной) практики:

#### 1) в части получение теоретических результатов:

- -сбор, систематизация и анализ материалов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР);
- обоснование целесообразности использования метода, процесса, оборудования и т.п., исследуемого в ВКР; технико-экономическая оценка выбранной темы;

#### 2) в части практических результатов:

- выполнение работ, связанных с темой ВКР и характером предстоящей профессиональной деятельности;
- -построение формальных математических моделей. алгоритмов проведения много-факторных экспериментов; определять параметры физических моделей объектов.
  - разработка и реализация методик выполнения измерений;
- -расчёт физико-технологических условий для проведения отдельных технологических процессов, составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС;
- правильный выбор оборудования для выполнения операций технологического процесса;
- демонстрация высокого уровня профессионального образования и стимулирование у руководства предприятия заинтересованности в предоставлении выпускнику трудоустройства на предприятии после окончания вуза.

## **3.** Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП. Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ.

Содержание практики является логическим продолжением разделов ООП — Б1.Б.08 Методы диагностики и анализа микро- и наносистем, Б1.Б.09 Теоретические основы электротехники, Б1.Б.12 Схемотехника, Б1.Б.14 Физические основы электроники, Б1.Б.15 Экономика и менеджмент финансов наукоемких предприятий, Б1.Б.17 Экология, Б1.В.01 Спектральные методы исследования, Б1.В.02 Теория вероятностей и математическая статистика, Б1.В.07 Физика полупроводников, Б1.В.09 Электромагнитные поля и волны, Б1.В.10 Теория электрических цепей, Б1.В.11 Алгоритмизация и программирование, Б1.В.12 Физика наноразмерных систем, Б1.В.13 Материалы и методы нанотехнологий, Б1.В.14 Электроника и служит основой для последующего изучения разделов ООП – Б1.В.ДВ.01.01 Наносенсоры, Б1.В.ДВ.01.02 Молекулярные устройства в электронике, Б1.В.ДВ.05.01 Физикохимия наноструктурных материалов, Б1.В.ДВ.06.01 Нанокомпозитныерадиопоглащающие материалы, Б1.В.ДВ.09.01 Магнитные наноматериалы, производственная практика и служит основой для последующего прохождения Итоговой государственной аттестации, а также формирования профессиональной компетентности в профессиональной области включающей создание и обеспечение функционирования электронных устройств и систем, основанных на использовании наноразмерных материалов или наноструктур. Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной (преддипломной) практики, необходимы для успешного проведения научных исследований и написания выпускной квалификационной работы.

#### 4. Тип и способ проведения производственной (преддипломной) практики.

Тип производственной практики: преддипломная.

Способ проведения производственной практики: стационарная.

Форма проведения производственной практики: дискретная, по периодам проведения практики.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор место прохождения производственной (преддипломной) учитывает состояние здоровья и выполнение требования по доступности.

В КубГУ обеспечен удаленный доступ обучающимся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к ресурсам образовательного портала для создания виртуальной мобильности при освоении образовательных программ. Также в Кубанском государственном университете обеспечена возможность просмотра содержания сайта университета слабовидящими.

В КубГУ обеспечено комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-педагогической комиссии:

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса, включает в себя организацию доступа к учебно-методическим материалам и помощь в организации самостоятельной работы через образовательный портал <a href="www.kubsu.ru">www.kubsu.ru</a> организационно-педагогическое сопровождение обеспечивают преподаватели, учебно-методическое управление
- психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности инвалида, ее профессиональное становление
- психолого-педагогическое сопровождение обеспечено управлением по учебновоспитательной работе медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала.

Медико-оздоровительное сопровождение обеспечено медицинским подразделением, кафедрой физического воспитания.

Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку инвалидов при инклюзивном обучении. Социальное сопровождение обеспечено управлением по воспитательной работе, деканом.

В Кубанском государственном университете обеспечено создание толерантной профессиональной и социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия.

## 5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной (преддипломной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен приобрести профессиональные компетенции в соответствии с  $\Phi \Gamma OC$  BO.

№ п.п.	Код компе- тенции	Содержание компетенции (или её части)	Планируемые результаты при прохождении практики
1.	ПК-1	способностью стро-	Знать численные методы, используемые в матема-
		ить простейшие фи-	тическом моделировании; метод конечных элемен-

№ п.п.	Код компе-	Содержание компе- тенции (или её ча-	Планируемые результаты при прохождении практики
11.11.	тенции	сти)	
		зические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования	тов, применительно к системам моделирования физических процессов; алгоритмы проведения многофакторных экспериментов при построении математических и физических моделей сложных объектов в электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.  Уметь строить формальные математические модели реальных объектов на основе экспериментального исследования их характеристик; определять параметры физических моделей объектов на основе экспериментального исследования их характеристик; применять численные методы при использовании моделей алгебраических уравнений и их систем в электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.  Владеть методами использования компьютерных технологий в моделировании и построения математических моделей конкретных физических объектов в электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
2.	ПК-2	способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения	Знать основы метрологии и стандартизации, основные методы измерения физических величин, номенклатуру метрологических характеристик и принцип действия различных типов средств измерений электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, оценивать нынешнее состояние и осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования, а также проводить калибровку средств измерений электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.  Владеть необходимыми теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать и реализовывать на практике методы обработки и оценки погрешности результатов измерений электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
3.	ПК-3	готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций	Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; требования, предъявляемые к форме и содержанию научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять и применять методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.

<b>№</b> п.п.	Код компе- тенции	Содержание компетенции (или её части)	Планируемые результаты при прохождении практики
	Тепции	CIN	Владеть необходимыми теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать и реализовывать на практике методы обработки и оценки погрешности результатов измерений электроники и наноэлектроники различного функционального назначения.
4.	ПК-8	способностью выполнять работы по технологической подготовке производства материалов и изделий электронной техники	Знать физико-технологические процесс производства изделий электронной компонентной базы, особенности проведения отдельных технологических операций, технологии изготовления ИМС на биполярных и МОП транзисторах и особенности их реализации; конструктивно-технологические варианты сборки, монтажа и герметизации ИМС.  Уметь рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных технологических процессов для получения активных и пассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.
5.	ПК-9	готовностью организовывать метрологическое обеспечение производства материалов и изделий электронной техники	Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, требования к такому оборудованию, основные характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь выбирать оборудование для выполнения операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а такжевыбора оборудования для решения конкретных технологических задач.
6.	ПК-13	способностью налаживать, испытывать, проверять работо- способность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого	Знать особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.  Уметь налаживать, испытывать, проверять работоспособность измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого

<b>№</b> п.п.	Код компе- тенции	Содержание компе- тенции (или её ча- сти)	Планируемые результаты при прохождении прак- тики
		для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники	для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.  Владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками для организации и проверки работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научно-технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники, а также ее налаживания в случае затруднений с работой и предварительной проверки.

#### 6. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 2 часавыделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 214 часов самостоятельной работы обучающихся. Продолжительность производственной (преддипломной) практики – 4 недели. Время проведения практики – 8 семестр.

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение представлено в таблице

			Бюджет
No॒	Разделы практики по видам	C	времени,
$\Pi/\Pi$	учебной деятельности	Содержание раздела	(недели,
			дни)
	Поді	готовительный этап	,
1.	Ознакомительная лекция,	Ознакомление с целью, задачами	
	включая инструктаж по	практики; инструктаж по	
	требованиям охраны труда	ознакомлению с требованиями	
		охраны труда, технике безопасности,	1
		пожарной безопасности, а также пра-	1 день
		вилами внутреннего трудового распо-	
		рядка	
2.	Ознакомление с правилами	Ознакомление со всеми установлен-	
	хранения и эксплуатации на	ными правилами хранения и эксплуа-	
	предприятии средств изме-	тации на предприятии средств изме-	
	рений.	рений	
	Экспериментал	ьный (производственный) этап	
3.	Ведение лабораторного	Последовательная, подробная запись	
	журнала.	собственных исследований	
4.	Выполнение эксперимен-		
	тальных работ по синтезу	На основе изученных источников вы-	
	наноматериалов и элементов	полнение экспериментальных работ	3-4 недели
	электроники и наноэлектро-	по синтезу наноматериалов и элемен-	
	ники.	тов электроники и наноэлектроники	
5.	Выполнение эксперимен-	На основе изученных источников вы-	1-2 недели
	тальных работ по изучению	полнение экспериментальных работ	

	параметров наноматериалов	по изучению параметров наноматери-	
	и элементов электроники и	алов и элементов электроники и нано-	
	наноэлектроники.	электроники.	
	3a	вершающий этап	
6.	Обработка и систематизация материала Подготовка отчета по практике. Получение отзыва, подготовка презентации и защита	Написание отчета по практике	2 дня

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с руководителем практики.

По итогам производственной (преддипломной) практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и практического материала.

Форма отчетности – дифференцированный зачет с выставлением оценки.

#### 7. Формы отчетности производственной (преддипломной) практики.

В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник практики и письменный отчет.

В отчет по практике входят:

#### 1. Дневник по практике (см. Приложение 2).

В дневнике на практику руководитель практики от кафедры должен заполнить: тема, задание (перечень работ), организация (место прохождения практики), сроки начала и окончания практики, продолжительность практики, навыки (приобретенные за время практики).

#### 2. Отчет по практике (см. Приложение 1).

Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной работе в период практики, результат выполнения индивидуального задания, а также краткое описание предприятия и организации его деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения.

**Заключение:** необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики и сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида практики.

#### Список использованной литературы

#### Приложения

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, рисунками.

#### Требования к отчету:

- титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;
- текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
  - нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
- текст отчета набирается в MicrosoftWord и печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата A-4: шрифт TimesNewRoman обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал полуторный; левое, верхнее и нижнее 2,0 см; правое 1,0 см; абзац 1,25. Объем отчета должен быть: 5-15 страниц.

К отчету прилагается: индивидуальное задание (Приложение 3), характеристика научного руководителя, текст научной статьи, написанная в ходе прохождения практики.

## 8. Образовательные технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике.

Практика носит научно-производственный характер, при ее проведении используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей—руководителей практики

от университета и руководителей практики от организаций, а также в виде самостоятельной работы студентов.

Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные технологии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.

В целом, можно говорить об использовании на практике следующих образовательных технологий:

- инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж на рабочем месте;
- организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.);
- вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками кафедры);
- наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста);
- информационно-коммуникационные технологии (информация из сети Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы;
- работу в библиотеке (уточнение содержания методологических и научных проблем, профессиональных и научных терминов);
  - прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
  - обобщение полученных результатов;
  - формулирование выводов и предложений по общей части программы практики;
- экспертизу результатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).

## 9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной (преддипломной) практики.

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении производственной (преддипломной)практики являются:

- 1. учебная литература;
- 2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
- 3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:

- ведение дневника практики;
- оформление итогового отчета по практике.
- анализ нормативно-методической базы организации;
- анализ научных публикации по заранее определённой руководителем практики теме;
- анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организаций.
  - работу с научной, учебной и методической литературой,
  - работа с конспектами лекций, ЭБС.
  - и т.д.

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.

#### Перечень учебно-методического обеспечения:

1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы:

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по производственной (преддипломной) практики.

Форма контроля производственной (преддипломной) практики по этапам формирования компетенций

№ п/п	Разделы (этапы) практики по видам учебной деятельности, включая самостоятельную работу обучающихся  Подготови Ознакомительная лекция, включая инструктаж по требованиям охраны труда, технике безопасно-	гельный ПК-2	Формы текущего контроль <b>i этап</b> документальная фиксация прохождения	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования прохождение и усвоение соответ-
	сти, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка		инструктажа. Записи в дневнике практики	ствующего ин-
	Экспериментальный (	произво	дственный) этаі	П
2.	Обзор отечественной и зарубежной научной литературы по теме исследования, выбранной в рамках программы магистерской подготовки. Составление рабочего плана диссертационного исследования с научным руководителем	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8	проверка от- чета по прак- тике	полнота представ- ленного материала в соответствии с индивидуальным заданием
3.	Обоснование темы магистерской диссертации, ее актуальности, степени исследования. Формулирование цели и задач, объекта и предмета, гипотезы исследования	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9	проверка от- чета по прак- тике	полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием
1	Заверша		Гап	an a ann a Mayyya a
4.	Подготовка отчета по практике	ПК-9, ПК- 13	собеседование	своевременное представление отчёта, качество оформления, защита отчёта, качество ответов на вопросы

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих мест в организации и контроль правильности формирования компетенций.

Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки документов (отчет, дневник). Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.

		Von rorr	Основни из призначен уторуга (посменять п
		Код кон- тролируе-	Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)
	Уровни сформирован-	мой компе-	пыс ларактеристики)
№ п/п	ности компетенции	тенции	
	пости компетенции	(или ее ча-	
		сти)	
1	Пороговый уровень	ПК-1	Знать минимальные общие принципы
	(уровень, обязатель-		численных методов, используемых вмате-
	ный для всех обучаю-		матическом моделировании; основы ме-
	щихся)		тода конечных элементов, применительно
			к системам моделирования физических
			процессов.
			Уметь строить формальные математиче-
			ские модели реальных объектов на основе
			экспериментального исследования их ха-
			рактеристик.
			Владеть ключевыми методами использо-
			вания компьютерных технологий в моде-
			лировании.
		ПК-2	Знать основы метрологии и стандартиза-
			ции и основные методы измерения физи-
			ческих величин.
			Уметь правильно выбирать средства из-
			мерений и на базовом уровне разрабаты-
			вать и реализовывать методики выполне-
			ния измерений.
			Владеть основными теоретическими зна-
			ниями, помогающими аргументированно
			выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.
		ПК-3	Знать базовые правила оформления мате-
		1110-5	риалов, научных отчетов, публикаций и
			презентаций.
			Уметь определять стандартные методы
			анализа и обработки экспериментальных
			данных.
			Владеть ключевыми принципами систем-
			ного подхода к анализу результатов науч-
			ных исследований.
		ПК-8	Знать физико-технологические основы
			процессов производства изделий элек-
			тронной компонентной базы, особенности
			проведения отдельных технологических
			операций.
			Уметь частично рассчитывать физико-
			технологические условия для проведения
			отдельных технологических процессов
			для получения минимальных активных и
			пассивных элементов электронной компо-
			нентной базы с требуемыми конструктив-
			ными и электрофизическими параметрами

			PHOHOTE KONICOTININI MOTO HIKOMI KON
			Владеть конкретными методиками кон-
			троля и анализа процессов электронной
			компонентной базы.
		ПК-9	Знать классификацию основного обору-
			дования производства изделий твердо-
			тельной микроэлектроники.
			Уметь выбирать оборудование для вы-
			полнения конкретных операций техноло-
			гического процесса.
			Владеть базовым набором навыков со-
			ставления маршрутных карт или профиль-
			ных технологических схем маршрутов изготовления ИМС.
		ПК-13	Знать базовые технологические прин-
			ципы работоспособности измерительного,
			диагностического, технологического обо-
			рудования, используемого для решения
			различных научно-технических, техноло-
			гических и производственных задач в об-
			ласти электроники и наноэлектроники.
			Уметь проверять работоспособность из-
			мерительного, диагностического, техно-
			логического оборудования, используе-
			мого для решения различных научно-тех-
			нических, технологических и производ-
			ственных задач в области электроники и
			наноэлектроники.
			Владеть необходимыми навыками для ор-
			ганизации и проверки работоспособности
			измерительного, диагностического, тех-
			нологического оборудования, используе-
			мого для решения различных научно-тех-
			нических, технологических и производ-
			ственных задач в области электроники и
			наноэлектроники, а также ее налаживания
			в случае затруднений с работой и предва-
			рительной проверки.
2	Повышенный уровень	ПК-1	Знать основы метрологии и стандартиза-
	(по отношению к по-		ции, основные методы измерения физиче-
	роговому уровню)		ских величин и номенклатуру метрологи-
	Poropowik Ahopuro)		ческих характеристик.
			Уметьстроить формальные математиче-
			ские модели реальных объектов на основе
			экспериментального исследования их ха-
			рактеристик; определять параметры физи-
			ческих моделей объектов на основе экспе-
			риментального исследования их характе-
			ристик.
			Владеть методами использования обяза-
			тельных компьютерных технологий в мо-
			делировании и построения математиче-
	•	•	

ПК-2  Знать необходимые концепции и принципы эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы	1 1		1
ПК-2  Знать необходимые концепции и принципы эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и напоэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосповными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			ских моделей некоторых конкретных фи-
ципы эффективной методики экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
тального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы		11K-2	
рактеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			± ±
ники различного функционального назначения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
чения для общего понимания ее специфики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			· ·
фики.  Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
Уметь правильно выбирать средства измерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.			
мерений, разрабатывать и реализовывать методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			1 *
методики выполнения измерений, осуществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			Уметь правильно выбирать средства из-
ществлять контроль за состоянием и применением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			мерений, разрабатывать и реализовывать
менением контрольно-измерительного оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			методики выполнения измерений, осу-
оборудования.  Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			ществлять контроль за состоянием и при-
Владеть основными теоретическими и практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			менением контрольно-измерительного
практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3 Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8 Знать физико-технологические процессы			оборудования.
практическими знаниями, помогающими аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3 Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8 Знать физико-технологические процессы			Владеть основными теоретическими и
аргументированно выбирать методы оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			практическими знаниями, помогающими
оценки погрешности результатов измерений.  ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			аргументированно выбирать методы
ПК-3  Знать правила оформления материалов, научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			оценки погрешности результатов измере-
научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
научных отчетов, публикаций и презентаций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы		ПК-3	Знать правила оформления материалов,
ций; базовые требования, предъявляемые к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			научных отчетов, публикаций и презента-
к форме научных отчетов, публикаций, презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			ций; базовые требования, предъявляемые
презентаций.  Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
Уметь определять необходимые методы анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
анализа и обработки экспериментальных данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			-
данных и результатов исследований.  Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
Владеть частичным системным подходом к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			± ±
к анализу результатов научных исследований иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
ний иосновными методами обработки результатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
зультатов измерения параметров и характеристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
теристик микро- и наноструктур.  ПК-8  Знать физико-технологические процессы			
ПК-8 Знать физико-технологические процессы			7
		ПК-8	
произволства излелий электронной ком-			производства изделий электронной ком-
			понентной базы, особенности проведения
			отдельных технологических операций, ба-
			зовые технологии изготовления ИМС на
			биполярных и МОП транзисторах и осо-
бенности их реализации.			
			Уметь рассчитывать физико-технологи-
			ческие условия для проведения отдельных
			технологических процессов для получе-
			ния активных и пассивных элементов
			электронной компонентной базы с требу-
			емыми конструктивными и электрофизи-
			ческими параметрами; частично состав-
	1 1		лять профильные или спиральные схемы
технологических процессов изготовления			
ИМС.			технологических процессов изготовления

	T		T D
			Владеть конкретными методиками кон-
			троля и анализа процессов электронной
			компонентной базы; информацией об об-
			ластях примененияразличных устройств
		TIC O	современной электроники.
		ПК-9	Знать классификацию основного обору-
			дования производства изделий твердо-
			тельной микроэлектроники, требования к
			такому оборудованию и основные харак-
			теристики оборудования.
			Уметь самостоятельно выбирать обору-
			дование для выполнения конкретных опе-
			раций технологического процесса.
			Владеть навыками составления маршрут-
			ных карт, профильных технологических
			схем маршрутов изготовления ИМС.
		ПК-13	Знать лишь определенные особенности и
			все необходимые базовые технологиче-
			ские принципы работоспособности изме-
			рительного, диагностического, техноло-
			гического оборудования, используемого
			для решения различных научно-техниче-
			ских, технологических и производствен-
			ных задач в области электроники и нано-
			электроники.
			Уметь испытывать, проверять работоспо-
			собность измерительного, диагностиче-
			ского, технологического оборудования,
			используемого для решения различных
			научно-технических, технологических и
			производственных задач в области элек-
			троники и наноэлектроники.
			Владеть необходимыми умениями и
			навыками для организации и проверки ра-
			ботоспособности измерительного, диа-
			гностического, технологического обору-
			дования, используемого для решения раз-
			личных научно-технических, технологи-
			ческих и производственных задач в обла-
			сти электроники и наноэлектроники, а
			также ее налаживания в случае затрудне-
			ний с работой и предварительной про-
			верки.
3	Продвинутый уровень	ПК-1	Знать основы метрологии и стандартиза-
	(по отношению к по-		ции, основные методы измерения физиче-
	вышенному уровню)		ских величин, номенклатуру метрологи-
			ческих характеристик и принцип действия
			различных типов средств измерений.
			Уметь строить формальные математиче-
			ские модели реальных объектов на основе
			экспериментального исследования их ха-

	рактеристик; определять параметры физи-
	ческих моделей объектов на основе экспе-
	риментального исследования их характе-
	ристик; применять численные методы при
	использовании моделей алгебраических
	уравнений и их систем.
	Владеть методами использования компь-
	ютерных технологий в моделировании
	исамостоятельного профессионального
	построения математических моделей кон-
	кретных физических объектов.
Пк	
	для глубокого понимания концепции и
	•
	принципы эффективной методики экспе-
	риментального исследования параметров
	и характеристик приборов, схем,
	устройств и установок электроники и
	наноэлектроники различного функцио-
	нального назначения.
	Уметь правильно выбирать средства из-
	мерений, самостоятельно разрабатывать и
	реализовывать методики выполнения из-
	мерений, оценивать нынешнее состояние
	и осуществлять контроль за состоянием и
	применением контрольно-измеритель-
	ного оборудования, а также проводить ка-
	либровку средств измерений.
	Владеть всеми необходимыми теоретиче-
	скими и практическими знаниями, помо-
	гающими аргументированно выбирать и
	реализовывать на практике методы обра-
	ботки и оценки погрешности результатов
	измерений.
ПК	1 1 1
	материалов, научных отчетов, публика-
	ций и презентаций; требования, предъяв-
	ляемые к форме и содержанию научных
	отчетов, публикаций, презентаций.
	Уметь определять и применять на прак-
	тике все необходимые методы анализа и
	обработки экспериментальных данных и
	результатов исследований.
	Владеть самостоятельным, четким и по-
	следовательным системным подходом к
	анализу результатов научных исследова-
	ний и методами обработки результатов из-
	мерения параметров и характеристик
	микро- и наноструктур.
Пк	
	1 1 1
	производства изделий электронной компонентной базы, особенности проведения
	т понентной базы, особенности проведения 1
	отдельных технологических операций,

технологии изготовления ИМС на биполярных и МОП транзисторах и особенности их реализации; конструктивно-технологические варианты сборки, монтажа и герметизации ИМС.  Уметь самостоятельно профессиопальнорассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных технологических процессов для получения активных и нассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные составлять профильные и спиральные составлять профильные и спиральные составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники, е особенности, требования к такому оборудования производства изделий твердогельной микроэлектроники, е особенности, требования к такому оборудованно, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования. Уметь самостоятельно выбирать оборудования и перечень инровых производита, в требований к размерам и парамстрам формируемых структур. Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем марпірутов изготовлення ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологических падач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологических прадинных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.	Γ	
сти их реализации; конструктивно-технологические варианты сборки, монтажа и герметизации ИМС.  Уметь самостоятельно профессиональнорассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных технологических процессов для получения активных и пассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы, достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердогельной микроэлектроники, се особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения вех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и парамстрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления марпрутных карт, профильных технологических ехам марпрутов изтотовления ИМС, а также выбора паиболес подходящего оборудования для решения технологических хадач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологических ода, а правогоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научиных научиных научиных научиных научиных научиных научиных научиных научиных и наноэлектроники и наноэлектроники.		
логические варианты сборки, монтажа и гермстизации ИМС.  Уметь самостоятельно профессионально-рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных технологических процессов для получения активных и пасснвных элемситов электроиной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическим парамстрами; составлять профильные и спиральные ехемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владсть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достовереной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердогельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производутелей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования и доподнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и парамстрам формируемых структур. Владсть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем марпирутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических для пирокого использования особенности и базовые технологических прищилы работоспособпости измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и навоэлектроники и навоэлектроники		лярных и МОП транзисторах и особенно-
герметизации ИМС.  Уметь самостоятельно профессионально- рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных техно- логических процессов для получения ак- тивных и пассивных элементов электрон- ной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные ехемы технологических про- цессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками кон- троля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной инфор- мащией об областях применения и пер- спективах развития различных функцио- нальных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования про- изводства изделий твердотельной микро- электроники, се особещности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых произ- водитслей сответствующего оборудова- ния.  Уметь самостоятельно выбирать обору- дование для выполнения всех необходи- мых операций технологического про- цесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур. Владеть навыками самостоятельного со- ставления маршрутных карт, профильных технологических схем маршругов изго- товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических схем маршругов изго- товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических оборудования для решения технологических оборудования, исполь- зуемого для решения различных научно- технических, технологических и произ- водственных задач в области электроники и наноэлектроники и наноэлектроники		сти их реализации; конструктивно-техно-
уметь самостоятельно профессионально- рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных техно- логических процессов для получения ак- тивных и пассивных элементов электрон- пой компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических про- цессов изготовления ИМС. Владеть необходимыми методиками кон- троля и апализа процессов электронной компонентной базы; достоверной инфор- мацией об областях применсим и пер- спективах развития различных функцио- нальных уалов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования про- изводства изделий твердотельной микро- электроники, се особепности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых произ- водителей соответствующего оборудова- ния.  Уметь самостоятельно выбирать обору- дование для выполнения весх необходи- мых операций технологического про- цесса, исходи из требований к размерам и параметрам формируемых структур. Владеть навыками самостоятельного со- ставления марпирутных карт, профильных технологических схем марпирутов изго- товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого ис- пользования особенности и базовые тех- нологически принципы работоспособно- сти измерительного, диагностнеского, технологического оборудования, исполь- зуемого для решения различных научно- технических, технологических и произ- водственных задач в области электроники и напоэлектроники.		логические варианты сборки, монтажа и
уметь самостоятельно профессионально- рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных техно- логических процессов для получения ак- тивных и пассивных элементов электрон- пой компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических про- цессов изготовления ИМС. Владеть необходимыми методиками кон- троля и апализа процессов электронной компонентной базы; достоверной инфор- мацией об областях применсим и пер- спективах развития различных функцио- нальных уалов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования про- изводства изделий твердотельной микро- электроники, се особепности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых произ- водителей соответствующего оборудова- ния.  Уметь самостоятельно выбирать обору- дование для выполнения весх необходи- мых операций технологического про- цесса, исходи из требований к размерам и параметрам формируемых структур. Владеть навыками самостоятельного со- ставления марпирутных карт, профильных технологических схем марпирутов изго- товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого ис- пользования особенности и базовые тех- нологически принципы работоспособно- сти измерительного, диагностнеского, технологического оборудования, исполь- зуемого для решения различных научно- технических, технологических и произ- водственных задач в области электроники и напоэлектроники.		герметизации ИМС.
рассчитывать физико-технологические условия для проведения отдельных технологических процессов для получегия активных и пассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудованиях операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для широкого истовления и для широкого истоя знать все псобходимые для широкого истоя знать все псобходимые для широкого истоя морительного, диагностического, технологических задач.  ПК-13  Знать все псобходимые для широкого истоя морительного, диагностического, технологических для непользования сообенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и папоэлектроники		
условия для проведения отдельных технологических процессов для получения активных и пассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные ехемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и переспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники, се особенности, требоващия к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производства изделий твердотельной микроэлектроники, се особенности, требоващия к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического порецесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления марпирутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологическия и произведения различных научнотехническия, технологическия и произведения задач в области электроники и напоэлектроники.		± ±
логических процессов для получения активных и пассивных элементов влектронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и апализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования прозъвктроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и персчень мировых производства изделий твердотельной микрозъвктроники, ее особенности, требования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для широкого использования особенности и базовые технологических задач.  ПК-13  Знать все псобходимые для широкого использования особенности и базовые технологических задач.  Тик-13  Знать все псобходимые для широкого использования особенности и базовые технологических пришипы работоспособности измерительного, диагностического, технологических и произвусмого для решения различных научнотехнического, для решения различных научнотехнических и производственных задач в области электроники и напоэлектроники.		= =
тивных и пассивных элементов электронной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владсть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и переспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9 Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления марпирутных карт, профильных технологических схем маршрутов ных технологических схем маршрутов товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13 Знать все пеобходимые для широкого использования особенности и базовые технологически и базовые технологически принципы работоспособности измерительного, диапностического, технологическия и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
ной компонентной базы с требуемыми конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических пропессо в изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудования, к такому оборудования, к такому оборудования, к такому оборудования перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Умсть самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршруктур.  Владеть навыками самостоятельного сотовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологических оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		-
конструктивными и электрофизическими параметрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических пропессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электропики.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектропики, се особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования сихоля из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршруттных карт, профильных текнологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
парамстрами; составлять профильные и спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности и змерительного, диагностического, технологического, борудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
спиральные схемы технологических процессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования прозвектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического, диагностического, технологического, диагностического, технологического, диагностического оборудования, используемого для решения различных научнотехническог, технологического, диагностического, технологического, диагностического, технологического, диагностического использования работостического, технологического, диагностического используемого для решения различных научнотехнического, диагностического использования работостического оборудования, используемого для решения различных научнотехнического, диагностического используемого для решения различных научнотехнического, диагностического используемого для решения различных научнотехнического, оборудования, используемого для решения различных научнотехнического оборудования, используемого для решения различных научнотехнического оборудования, используемого для решения различных и и наноэлектроники.		
пессов изготовления ИМС.  Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
Владеть необходимыми методиками контроля и анализа процессов электронной компонентной базы; достоверной информащией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исхоля из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы рабогособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
троля и анализа пропессов электронной компонентной базы; достоверной информацией об областях применсния и перспективах развития различных функциональных уэлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы рабозоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники		
компонентной базы; достоверной информацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для пирокого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных паучнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники		
мацией об областях применения и перспективах развития различных функциональных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Зиать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения веех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Зиать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		*
пк-9  ПК-9  ПК-9  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования дия, выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических ехем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
ПК-9  Нальных узлов и устройств современной электроники.  ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования и перещения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники и наноэлектроники		
ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микроэлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
ПК-9  Знать классификацию оборудования производства изделий твердотельной микрозлектроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
изводства изделий твердотельной микро- электроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.	<u> </u>	
электроники, ее особенности, требования к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического, оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.	ПК-9	
к такому оборудованию, характеристики оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического, диагностического, технологического, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
оборудования и перечень мировых производителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
водителей соответствующего оборудования.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
ния.  Уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
уметь самостоятельно выбирать оборудование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		водителей соответствующего оборудова-
дование для выполнения всех необходимых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		ния.
мых операций технологического процесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
цесса, исходя из требований к размерам и параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		дование для выполнения всех необходи-
параметрам формируемых структур.  Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		мых операций технологического про-
Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		цесса, исходя из требований к размерам и
Владеть навыками самостоятельного составления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		параметрам формируемых структур.
ставления маршрутных карт, профильных технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
технологических схем маршрутов изготовления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
товления ИМС, а также выбора наиболее подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
подходящего оборудования для решения технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
Технологических задач.  ПК-13  Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
ПК-13 Знать все необходимые для широкого использования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
пользования особенности и базовые технологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.	ПК-13	
нологические принципы работоспособности измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.	1110 13	
сти измерительного, диагностического, технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		
технологического оборудования, используемого для решения различных научнотехнических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		<u> </u>
зуемого для решения различных научно- технических, технологических и произ- водственных задач в области электроники и наноэлектроники.		-
технических, технологических и производственных задач в области электроники и наноэлектроники.		**
водственных задач в области электроники и наноэлектроники.		1 -
и наноэлектроники.		<u> </u>
		Уметь налаживать, испытывать, прове-
рять работоспособность измерительного,		рять работоспособность измерительного,

диагностического, технологического обо-
рудования, используемого для решения
различных научно-технических, техноло-
гических и производственных задач в об-
ласти электроники и наноэлектроники.
Владеть необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками для организации и про-
верки работоспособности измеритель-
ного, диагностического, технологиче-
ского оборудования, используемого для
решения различных научно-технических,
технологических и производственных за-
дач в области электроники и наноэлектро-
ники, а также ее налаживания в случае за-
труднений с работой и предварительной
проверки.

#### Критерии оценки отчетов по прохождению практики:

- 1. Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
- 2. Своевременное представление отчёта, качество оформления;
- 3. Защита отчёта, качество ответов на вопросы.

Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения производственной (преддипломной) практики

Шкала оце-	Критерии оценки	
нивания		
	Зачет с оценкой	
«Отлично»	Содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание учебного материала, выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных вопросов.	
«Хорошо»	Основные требования к прохождению практики выполнены, однако имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению отчета по практике и дневника прохождения практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает знание учебного материала, однако ответы неполные, но есть дополнения, большая часть материала освоена.	
«Удовлетво- рительно»	Основные требования к прохождению практики выполнены, однако имеются существенные замечания по содержанию и оформлению отчета по практике и дневника прохождения практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях учебного материала, неточно раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь только дополнениями.	
«Неудовле-	Небрежное оформление отчета по практике и дневника прохождения	
твори-	практики. В отчете по практике освещены не все разделы программы	
тельно»	практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана не	

выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся об-
наруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала,
поставленные вопросы не раскрыты либо содержание ответа не соот-
ветствует сути вопроса. Отчет по практике не представлен.

## 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (преддипломной) практики:

#### а) основная литература:

- 1. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 210100 "Электроника и наноэлектроника" и 222900 "Нанотехнологии и микросистемная техника" / В. А. Мошников, Ю. М. Таиров, Т. В. Хамова, О. А. Шилова; под ред. О. А. Шиловой. Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. 292 с.
- 2. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов. Шилова О.А. [Электронный ресурс] Электрон. дан. Издательство "Лань". Издание: 1-е изд. 2013. 304 с. Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/12940">https://e.lanbook.com/book/12940</a>
- 3. Нанотехнологии в электронике-3.1. Под редакцией Чаплыгина Ю.А. Москва: Техносфера. 2016. 480 с. Режим доступа: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book\_red&id=444856">http://biblioclub.ru/index.php?page=book\_red&id=444856</a>
- 4. ЦаоГочжун, Ин Ван. Наноструктуры и наноматериалы. Синтез, свойства и применение / пер. с англ. 2-го издания А.И. Ефимова, С.И. Каргов; науч. ред. русс. изд. В.Б. Зайцев. М.: Научный мир. 2012. 520 с.

#### б) дополнительная литература:

- 1. Елисеев А.А., Лукашин А.В. Функциональные наноматериалы : учебное пособие для вузов.— М.: ФИЗМАТЛИТ. 2010.— 452 с.
- 2. Киреев В. Ю. Нанотехнологии в микроэлектронике. Нанолитография процессы и оборудование. М: ИД Интеллект, 2016 г. 320 с.
- 3. Материалы и элементы электронной техники. Активные диэлектрики, магнитные материалы, элементы электронной техники. Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. [Электронный ресурс] Электрон. дан. Издательство "Лань", 2-е изд., испр., 2016. 384 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71735
- 4. Мороз А. В., Вашури Н. С. Основы лучевых и плазменных технологий: лабораторный практикум. [Электронный ресурс] Электрон. дан. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. 120 с. Режим доступа: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book\_red&id=477392">http://biblioclub.ru/index.php?page=book\_red&id=477392</a>
- 5. Нанотехнологии: азбука для всех / под ред. Ю. Д. Третьякова; [Н. С. Абрамчук и др.]. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 365 с.
- 6. Наноэлектроника: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. / В. Е. Борисенко [и др.]. 4-е. Москва : Лаборатория знаний, 2015.-369 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/84103. ЭБС Издательства «Лань».
- 7. Основы нано- и функциональной электроники [Электронный ресурс]. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Издательство "Лань". 2013. 2-е изд., испр. 320 с. Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/5855">https://e.lanbook.com/book/5855</a>
- 8. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий: учеб. Пособие. 2-е изд. М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2010. 431 с.
- 11. Рыжонков Д.И., Левина В.В., Дзидзигури Э.Л. Наноматериалы. Учебное пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 365 с.
- 9. Технология получения полимерных пленок специального назначения и методы исследования их свойств: учебное пособие. [Электронный ресурс] Электрон. дан. Казань: Издательство КНИТУ, 2014. 182 с. Режим доступа:

#### в) периодические издания.

В библиотеке КубГУ имеются следующие периодические издания по профилю дисциплины:

- 1. Научно-теоретический журнал «Физика твердого тела».
- 2. Научно-теоретический журнал «Журнал экспериментальной и теоретической физики».
  - 3. Научно-теоретический журнал «Письма в ЖЭТФ».
  - 4. Научный обзорный журнал «Успехи физических наук».
  - 5. Научный обзорный журнал «Успехи химии».
  - 6. Научно-производственный журнал «Нанотехнологии. Экология. Производство».
  - 7. Научный обзорный журнал «Российские нанотехнологии».

## 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения производственной (преддипломной) практики.

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:

- **1.** Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений (www.informuo.ru);
  - 2. Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
- **3.** Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/;
- **4.** Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/.

## 13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по производственной (преддипломной) практике, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе организации производственной (преддипломной) практики применяются современные информационные технологии:

- 1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
- 2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.

При прохождении практики студент может использовать имеющиеся на кафедре теоретической физики и компьютерных технологий программное обеспечение и Интернетресурсы.

#### 13.1 Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1. Apophysis
- 2. Cisco packet tracker
- 3. CmapTools
- 4. CodeBlocks
- 5. Delphi 7
- 6. Eclipse
- 7. Far Manager
- 8. Free Pascal
- 9. Gimp 2
- 10. IDLE (Python)
- 11. Inkscape
- 12. IntelliJ IDEA

- 13. Pycharm
- 14. Matlab R2014a
- 15. Firefox
- 16. GNS3
- 17. Notepad++
- 18. Paint.net
- 19. PascalABC
- 20. SWI-Prolog
- 21. Protégé
- 22. Mathcad Prime 3
- 23. Statistica
- 24. Total Commander
- 25. Visual Studio 2013
- 26. Visual Studio 2015
- 27. Google chrome
- 28. Office 2013
- 29. Mathematica 10.2
- 30. Microsoft Visio
- 31. ΚΟΜΠΑC 3D LT12
- 32. AUTOCAD 2016

#### 13.2 Перечень информационных справочных систем:

- 1. Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа: <a href="http://garant.ru/">http://garant.ru/</a>;
- 2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа: <a href="http://consultant.ru/">http://consultant.ru/</a>;
- 3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
  - 4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru).

### 14. Методические указания для обучающихся по прохождению производственной (преддипломной) практики.

Перед началом производственной (преддипломной) практики на предприятии студентам необходимоознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности.

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия.

Студенты, направляемые на практику, обязаны:

- явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
- детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
- явиться на место практики в установленные сроки;
- выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую работу;
- проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на практике;
- выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить отчет о практике.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

### 15. Материально-техническое обеспечение производственной (преддиплом-

ной) практики

№	ну практики Наименование специальных помещений и помещений для са- мостоятельной работы	Номера ауди- торий / каби-	
		нет	ОВ
1.	Лекционные аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами	201C, 209C, 213C	207C, 212C,
2.	Аудитории для проведения занятий семинарского типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения	207C, 212C, 2	209C, 13C
3.	Компьютерные классы с выходом в Интернет на 16 посадочных мест	207C, 213C	212C,
4.	Аудитории для выполнения научно—исследовательской работы (курсового проектирования, выполнения исследований по магистерской диссертации), укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения	208C, 224C	223C,
5.	Аудитории для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин	207C, 212C, 224C	208C, 213C,
6.	Учебные специализированные лаборатории и кабинеты, оснащенные лабораторным оборудованием (рабочие станции, мультимедийное оборудование)	207C, 213C	212C,
7.	Учебно-методический, исследовательский ресурсный центр — Учебно-научный центр компьютерных технологий укомплектован специализированной мебелью и техническими средствами обучения	213C, 224C	213C,
8.	Методический кабинет или специализированная библиотека – лаборатория Информационно-аналитического обеспечения, оснащенная компьютерными рабочими местами с выходом в Интернет	202C	
9.	Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	214C	
10.	Помещение для проведения текущей и промежуточной аттестации, укомплектованное специализированной мебелью и техническими средствами обучения	209C, 2	23C

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет Физико-технический факультет Кафедра радиофизики и нанотехнологий

## ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

по направлению подготовки (специальности)

Выполнил	
Ф.И.О. студента	
Руководитель производственной (преддипломной) практики	
ученое звание, должность, $\Phi.И.O$	

Краснодар 2018г.

## ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Напра	вление подготовки (специальности)	
Фами. Курс	лия И.О студента	
Время	проведения практики с «»20 г. по «	»20г.
Дата	Содержание выполняемых работ	Отметка руководителя практики от организации (подпись)

### ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

	Факультет		
	Кафедра		
	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, І ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ		
Сту	удент		+
J	(фамилия, имя, отчес	тво полностью)	
Har	правление подготовки (специальности)		
Me	сто прохождения практики		
Сро	ок прохождения практики с по		2018r
гоч	ь практики – изучение теоретических и прав ными для успешного выполнения и защиты в рование следующих компетенций, регламент	ыпускной квалифи	кационной работы, фор-
l.С уст наз	пособность строить простейшие физические ройств и установок электроники и наноэл начения, а также использовать стандартные целирования.	и математические пектроники различ	модели приборов, схем, ного функционального
2. С год уст наз	Способность аргументированно выбирать и ре ику экспериментального исследования пара ройств и установок электроники и наноэл начения. Сотовность анализировать и систематизирова	метров и характеј пектроники различ	ристик приборов, схем, ного функционального
мат 4. С	ериалы в виде научных отчетов, публикаций Способность выполнять работы по технологи	, презентаций.	-
5. Г	и изделий электронной техники. отовность организовывать метрологическое с ий электронной техники.	обеспечение произв	водства материалов и из-
5. <b>(</b> циа нау	опособность налаживать, испытывать, проводность налаживать, испытывать, проводностического, технологического оборудованию-технических, технологических и производовлектроники.	ния, используемого	для решения различных
	речень вопросов (заданий, поручений) для пр	охождения практин	ки
	План-график выпо	лнения работ:	
Võ	Этапы работы (виды деятельности) при прохождении практики	Сроки	Отметка руководи- теля практики от университета о вы-
			полнении (подпись)

1					
2					
	Ознакомлен				
<b>«</b>	»г.				

### ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

# результатов прохождения производственной (преддипломной) практики по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (профиль «Нанотехнологии в электронике»)

Фамилия И.О студента	
Курс	

$N_{\underline{0}}$	ОБЩАЯ ОЦЕНКА	Оценка			
	(отмечается руководителем практики)	5	4	3	2
1.	Уровень подготовленности студента к прохождению				
	практики				
2.	Умение правильно определять и эффективно решать ос-				
	новные задачи				
3.	3. Степень самостоятельности при выполнении задания по				
	практике				
4.	Оценка трудовой дисциплины				
5.	Соответствие программе практики работ, выполняемых				
	студентом в ходе прохождении практики				

Руководитель практики	
	(подпись) (расшифровка подписи

$N_{\underline{0}}$	СФОРМИРОВАННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОД-	Оценка			
	СТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ	5	4	3	2
	КОМПЕТЕНЦИИ				
	(отмечается руководителем практики от университета)				
1.	ПК-1 – способность строить простейшие физические и ма-				
	тематические модели приборов, схем, устройств и устано-				
	вок электроники и наноэлектроники различного функцио-				
	нального назначения, а также использовать стандартные				
	программные средства их компьютерного моделирования.				
2.	ПК-2 – способность аргументированно выбирать и реали-				
	зовывать на практике эффективную методику эксперимен-				
	тального исследования параметров и характеристик прибо-				
	ров, схем, устройств и установок электроники и наноэлек-				
	троники различного функционального назначения.				
3.	ПК-3 – готовность анализировать и систематизировать ре-				
	зультаты исследований, представлять материалы в виде				
	научных отчетов, публикаций, презентаций.				
4.	ПК-8 – способность выполнять работы по технологической				
	подготовке производства материалов и изделий электрон-				
	ной техники.				
5.	ПК-9 – готовность организовывать метрологическое обес-				
	печение производства материалов и изделий электронной				
	техники.				
6.	ПК-13 – способность налаживать, испытывать, проверять				
	работоспособность измерительного, диагностического,				
	технологического оборудования, используемого для реше-				
	ния различных научно-технических, технологических и				

	производственных задач в области электроники и нано-электроники.						
Руководитель практики							